06;07;12 Исследование свойств тонких пленок CuGaTe₂

© И.В. Боднарь, В.Ф. Гременок, И.А. Викторов, Д.Д. Криволап

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь Институт физики твердого тела и полупроводников, Минск, Беларусь

Поступило в Редакцию 11 июля 1997 г.

Методом импульсного лазерного напыления получены тонкие пленки тройного соединения CuGaTe₂. Рентгеновским методом определена их структура и параметры элементарной ячейки. По спектрам пропускания в области края основной полосы поглощения определены энергии межзонных оптических переходов и рассчитаны величины кристаллического ($\Delta_{\rm kp}$) и спин-орбитального ($\Delta_{\rm co}$) расщепления.

Тройное соединение CuGaTe₂ относится к классу соединений I–III–VI₂, кристаллизующихся в структуре халькопирита (пространственная группа D_{2d}^{12} –142*d*) и является перспективным материалом для использования его в различных устройствах оптоэлектроники [1]. Указанное соединение является малоизученным материалом, что связано с трудностями получения его качественных монокристаллов и пленок. В работе [2] нами были изучены электрические, оптические и тепловые свойства кристаллов CuGaTe₂, полученных двухтемпературным методом.

В настоящей работе приведены результаты исследования структуры и оптических свойств тонких пленок CuGaTe₂, полученных импульсным лазерным испарением. В качестве мишени применялись кристаллы, синтезированные направленной кристаллизацией расплава [3].

Напыление пленок проводилось в вакууме $(2-4) \cdot 10^{-5}$ Torr с помощью лазера Nd:YAG ($\lambda = 1.06 \,\mu$ m, $\tau_{\rm имп} = 10^{-3}$ s, $E_{\rm имп} = 150-180$ J) [4]. Подложками служили химически очищенные стекла, температура которых поддерживалась ~ 690 К. Толщина пленок CuGaTe₂, составляла ~ 0.6 μ m.

Состав пленок устанавливали с помощью микрозондового рентгеноспектрального анализа. Согласно полученным данным, атомный состав

18

(в пределах погрешности измерений $\sim 4\%$) соответствует формуле соединения CuGaTe2 и воспроизводился при диагностике различных участков пленки.

Структуру и параметры полученных кристаллов и пленок определяли рентгеновским методом. Дифрактограммы записывали на рентгеновском аппарате "ДРОН-ЗМ" в Си К_{α}-излучении с никелевым фильтром. Проведенные исследования показали, что на дифрактограммах пленок (как и кристаллов CuGaTe₂) присутствовала система линий, соответствующая структуре халькопирита. Параметры элементарной ячейки, рассчитанные по рефлексам, для которых $2\Theta > 65^{\circ}$, равны: $a = 6.023 \pm 0.005$ Å и $c = 11.92 \pm 0.01$ Å, что согласуется с данными для объемных кристаллов ($a = 6.024 \pm 0.005$ Å, $c = 11.93 \pm 0.01$ Å) [2,3,5].

Электрические измерения пленок CuGaTe2 показали, что они обладают *p*-типом проводимости и удельным сопротивлением $\sim 4\cdot 10^{-2}\,\Omega\cdot{\rm cm}.$

На пленках CuGaTe₂ проведены измерения спектрального распределения коэффициентов пропускания и отражения в области края основной полосы поглощения. Спектры регистрировались на спектрофотометре "Beckman-5270" и "Specord-GINIR" при 293 К в спектральном диапазоне 500–2000 nm. Коэффициент поглощения рассчитывали по формуле:

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left(A + \sqrt{A^2 + R^2} \right),\tag{1}$$

где d — толщина образца, $A = (1 - R)^2/2T$, T — пропускание, R — коэффициент отражения в интервале 0.5–1.3 μ m, величина постоянная и равная ~ 30% [6].

На рис. 1, *а* представлен спектр пропускания пленок CuGaTe₂. Значительная величина пропускания в области края основной полосы поглощения (более 40%) и четкая интерференционная картина свидетельствуют о совершенстве осажденных пленок.

На рис. 1, *b* приведена спектральная зависимость коэффициента оптического поглощения (α) от энергии фотона. Видно, что полученные пленки соединения CuGaTe₂ обладают высоким коэффициентом поглощения в исследованной области ($10^4 - 10^5$ cm⁻¹) и имеют сложную структуру края собственного поглощения, что в соответствии с моделью Хопфилда [7] для соединений A¹B^{III}C^{VI}₂ обусловлено p-d-гибридизацией валентной зоны в этих соединениях.

Анализ указанной зависимости показывает, что основной вклад в структуру поглощения пленок CuGaTe₂ вносят прямые разрешенные



Рис. 1. a — спектры пропускания пленок CuGaTe₂. Толщина пленок 0.6 μ m; b — зависимость коэффициента поглощения (α) от энергии фотона ($h\nu$).

переходы, определенные из зависимости

$$\alpha = \frac{A}{h\nu} \left(h\nu - E_g\right)^{1/2}.$$
 (2)

Зависимость $(\alpha \cdot h\nu)^2$ от энергии фотона, по которой определялись энергии межзонных переходов, приведена на рис. 2. Полученные нами значения энергий оптических переходов для CuGaTe₂ составляют: $E_{g1} = 1.35 \pm 0.01$ eV, $E_{g2} = 1.43 \pm 0.01$ eV, $E_{g3} = 1.88 \pm 0.01$ eV, что согласуется с результатами [5] по исследованию фотолюминесценции объемных кристаллов.



Рис. 1 (продолжение).

Исходя из полученных нами результатов и данных [5,6], можно заключить, что переход с энергией $E_{g1} = 1.35 \,\mathrm{eV}$ соответствует переходу $\Gamma_7^{\rm V}$ –U $_6^{\rm C}$ (переход валентная зона–зона проводимости). Переход $E_{g2} = 1.43 \,\mathrm{eV}$ связан с расщеплением валентной зоны под действием поля кристаллической решетки ($\Delta_{\rm kp}$) $\Gamma_6^{\rm V}$ – $\Gamma_6^{\rm C}$ и переход $E_{g3} = 1.88 \,\mathrm{eV}$ обусловлен спин-орбитальным ($\Delta_{\rm co}$) расщеплением валентной зоны $\Gamma_7^{\rm V}$ – $\Gamma_6^{\rm C}$.



Рис. 2. Спектральная зависимость $(\alpha \cdot h\nu)^2$ от энергии фотона.

В соответствии с квазикубической моделью Хопфилда величины энергий кристаллического и спин-орбитального расщепления валентной зоны были рассчитаны по следующим соотношениям [6]:

$$\Delta_{\kappa p} = \frac{E_2 + E_1}{2} - \frac{1}{2} \left[(E_2 + E_1)^2 - 6E_1 E_2 \right]^{1/2}, \qquad (3)$$

$$\Delta_{\rm co} = \frac{E_2 + E_1}{2} + \frac{1}{2} \left[(E_2 + E_1)^2 - 6E_1 E_2 \right]^{1/2},\tag{4}$$

где $E_1 = E_{g1} - E_{g2}$; $E_2 = E_{g3} - E_{g2}$.

Для пленок CuGaTe2 указанные величины равны: $\Delta_{\kappa p}=-0.115\,\text{eV},$ $\Delta_{co}=0.485\,\text{eV}.$

Выводы.

На пленках тройного соединения CuGaTe₂, полученных лазерным напылением, исследованы структурные и оптические свойства. Показано, что пленки CuGaTe₂, как и объемные кристаллы, кристаллизуются в структуре халькопирита. Определены значения параметров элементарной ячейки для указанных кристаллов и пленок, величины энергий межзонных переходов и рассчитаны величины кристаллического и спинорбитального расщепления.

Список литературы

- [1] Коутс Т., Микин Дж. // Современные проблемы полупроводниковой фотоэнергетики. М.: Мир, 1988. С. 307.
- [2] Боднарь И.В. // Неорганические материалы. 1991. Т. 27. С. 2068-2071.
- [3] Bodnar I.V., Orlova N.S. // Cryst. Res. Technol. 1986. V. 21. N 8. P. 1091–1095.
- [4] Bodnar I.V., Gremenok V.F., Zaretskaya E.P., Victorov I.A. // Thin Solid Films. 1992. V. 207. N 1. P. 54–56.
- [5] Masse G., Djessas K., Yarzhou // J. Appl. Phys. 1993. V. 74. P. 1370-1381.
- [6] Shay J.L., Wernick J.H. // Ternary Chalcopyrite Semiconductors: Growth, Electronic Properties and Applications. Pergamon Press, Oxford, 1975. P. 244.
- [7] Shay J.I., Tell B., Kasper H.M., Shiovane L.M. // Phys. Rev. (B). 1972. V. 5. N 12. P. 5003–5005.